C 9

スラントパス法を用いた成層圏大気の光学的厚さの計測

Lidar Measurements of Optical Thickness

of the Stratosphere by the Slant Path Method

飯倉善和、林田佐智子、清水浩

Y. IIkura, S. Hayashida, and H. Shimizu

国立公害研究所

The National Institute for Environmental Studies

1. はじめに

大気の状態が水平方向に一様な場合、レーザ ーの発射角度を変えて測定した信号を比較する ことにより大気の光学的厚さを後方散乱係数と は独立に求めることが可能である。この方法は スラントパス法として知られており、これまで 対流圏や中間圏における光学的厚さの計測が試 みられている。しかしスラントパス法による大 気の光学的厚さの計測は誤差にたいして非常に 敏感なため、測定やデータ解析上において高い 精度が要求される。

本論では、スラントパス法で問題となる測定 誤差の要因とその対策を検討するとともに実測 データの統計的解析からえられた光学的厚さの 計測結果を示す。

2. 測定誤差要因

スラントパス法における誤差要因として、以 下の点に関する検討が必要となる。

1) レーザーレーダーの測定信号には、Fig. 1 に示すように背景光雑音や光電子増倍管で生 ずる系統的雑音が含まれる。著者らは光電子増 倍管の応答特性の実験データに基づいた系統的 雑音の補正およびマッチング法の統計的観点か らの改良を行った。その結果、Fig.2 (b)に示し たように高度30km以上でレイリー散乱の計 算値に良く一致した後方散乱比の鉛直プロファ イルが得られた。

2) スラントパス法ではデータ解析で用いる高度として、地球の曲率とレーザー光の屈折を含んだ正確な高度の位置決めが必要となる。これ に関して、筆者らは次の light ray equation に基づいた正確な位置決めの簡便なアルゴリズ ムを開発した。





R nosin θo = (R + y) nysin θy
3) スラントパス法では大気の水平方向の一様
性が仮定されるが、成層圏において、この仮定
がどの程度妥当であるかを成層圏の立体的観測
により確認する必要がある。

3. 実測データの解析

(1) 測定データ

10

40

HEIGHT (km) 05 05

10

EL = 50°

測定は1984年2月20日の夜間に、方位 (東、南)と高度角(50°,35°,25°,20°)を変え て行い、計8個の測定データを得た。また各測 定では10000発のレーザーパルスを発射し、デー タとしてはその積算平均値を用いた。

測定データに対して、系統的雑音の補正 と 統計的マッチング法によるキャリブレーション を行い、次に示す光学的厚さの影響を含む大気 の後方散乱係数の値を求めた。

 β^* (h, θ) = β (h) exp($2\tau_h^{h^*}/\sin\theta$) 但しマッチングは高度(h^{*})32kmの近傍2 kmの範囲のデータについて行った。

Fig.3 に、得られた β* と空気分子の後方散乱 係数の比である後方散乱比の鉛直プロファイル を示した。このデータでは高度 30 km付近ま でエアロゾルが存在しているが、これは約1年 前のエルチチョンの噴火によるエアロゾルである。

1984 FEB.20 (EAST) $40 \xrightarrow{\text{EL} = 50^{\circ}} 35^{\circ} 25^{\circ} 20^{\circ}$ $40 \xrightarrow{\text{EL} = 50^{\circ}} 35^{\circ} 25^{\circ} 20^{\circ}$ $40 \xrightarrow{\text{EL} = 50^{\circ}} 35^{\circ} 25^{\circ} 20^{\circ}$ $40 \xrightarrow{\text{EL} = 50^{\circ}} 35^{\circ} 25^{\circ} 20^{\circ}$

(SOUTH)

35°

解析に用いた高度は地球の曲率とレーザー光 の大気中の屈折の影響を補正したものであり、 各測定データに表れたエアロゾル層のピークの 高度の系統的な違いはみられない。ただし方位 を東に取った測定では、高度20kmと高度2 3kmのピークに数100mの変動がみられた。 (2)光学的厚さの解析

Fig. 3 では、高度角が小さくなるにしたがい 高度 3 0 km以下の後方散乱比の値が増加して いる。これは β^* にふくまれる光学的厚さが高. 度角により異なるためである。この対数をとって $\log \beta^*$ と cosec θ をそれぞれ目的変数 Y と説明 変数 X とすれば、光学的厚さ τ は次の回帰式 の回帰係数となる。

$Y = 2\tau X + \log(\beta(h))$

最小自乗法を用いて、8個の測定データから 光学的厚さを推定した結果を Fig.4 に示した。 但しデータの精度を高めるため各高度の近傍1 kmの測定データを指数関数を用いて内捜した 結果を光学的厚さの計算に用いた。また光学的 厚さは測定信号の変動の小さい高度21 kmか ら対象とする高度までの値として示した。さら に回帰分析における誤差の解析から、光学的厚 さの標準誤差を求めた結果を図に示した。

Fig.4 より、高度13kmから21kmまで の光学的厚さは 0.055、高度21kmから30 kmまでは 0.023 となる。またこの時の測定 精度は各々 8% と 60% であった。



Fig.3 スラントパス法に用いた測定データ

SCATTERING RATIO

25

Fig.4 光学的厚さの解析結果

20°